IQC 檢驗重點

料號

10HB5-141060-20R

品名規格

CHIP GP106-300-A1 NVIDIA SMD FCBGA 2152(GB4-256)

零件樣品圖:





外觀文字面檢驗重點:

- 1.NVIDIA: Company name (不可變)
- 2.S: Single alpha assembly plant identifier(不可變)
 - -A = ASE
 - -N=SCC
 - -S= SPIL
 - -R= Amkor

TAIWAN: Country of origin(不可變)

-Taiwan: ASE , SPIL , Amkor

-China: SCC

3.1621: Assembly date code(可變)

Al: Mask revision(不可變)

4.P: The wafer Fab location(不可變)

6V203.094: Assembly lot number(可變)

- 5. GP106-300-A1: Product Part Number(不可變)
- 6. QUAL SAMPLE為廠商SAMPLE標識

此為For試產使用Sample, 量產時外觀Marking將不允許

QUAL SAMPLE標識Show出,否則將判定為不允收.

7. PIN 1(不可變)

D/C1739料件新增2維碼,2維碼主要為晶片本身識別追蹤生產來源, 無功能變動,現將2維碼料件加入IQC檢驗允收規範.

機構尺寸工程圖:

908-ball BGA, 29mm x 29mm(GB4C-128)

IQC電氣、機構檢驗重點:

- 1. 量測各部尺寸須與規格值相符.
- 2. 檢視產品外觀,表面無異物,且不得有任何破損及變形.

μ-EDX 有害物質檢測:

μ-EDX 需依照HCSR 有害物質管制規範實施檢測,並參照FP-0743-05-03 IQC EDX Test Guide 規範。

Date: 2016/09/18	Rev. 00	首次發行
Date: 2017/11/3	Rev. 01	將2維碼料件加入IQC檢驗允收規範